

接着に関わる表面分析技術

Adhesion-related Surface Analysis Technology

Toshiya ISHII*

*MATERIACL ANALYSIS RESEARCH LABORATORY TECHNICAL RESEARCH INSTITUTE TOPPAN PRINTING CO., LTD

4-2-3, Takanodaiminami, Sugito-machi, Saitama, 345-8508 JAPAN

1. はじめに

接着の歴史を振り返ると旧約聖書に登場する「ノアの方 舟」の船体の木材の隙間にはアスファルトが詰められてい たという.また、エジプトのツタンカーメン王の墓から出 土した箱や家具にはニカワで接着した合板が使われていた という.東洋では接着剤としてウルシが広く使われていた. 日本では室町時代に建造された金閣寺は金箔の貼り付けに ウルシを接着剤として用いていた¹⁾.

現代社会において我々が生活している環境を見渡すと各 種印刷物,包装材料,電化製品,建築・土木,自動車,航 空機及びスペースシャトルに代表される宇宙産業など接着 技術なしでは成り立たっていない.このように接着技術は あらゆる産業にとって重要な役割を担っており,これら製 品の接着性を上げることは大きな課題となっている.この ため接着要因を解析する分析技術は重要な位置を占めてい ることは間違いない.ここでは,接着の理論,表面分析の 種類,表面分析技術によって接着性の要因がどのように評 価・解析できるか,熱水処理アルミニウム箔と低密度ポリ エチレンの接着性の解析を例に用いて述べる.

2. 接着の理論

接着のメカニズムは接着の現象をすべて網羅し,完璧に 説明できているわけではなく,時代とともにいくつかの説 が唱えられてきた.また,各々の説は被着体とその相手の

* 凸版印刷(株)総合研究所 物性評価研究所
 (〒 345-8508 埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台南 4-2-3)

種類によって,いずれかの説が主役を演じているかにすぎ ない.これらは実際に接着されている界面の分析が非常に 困難なことに起因し,完成された理論はなく説に留まって いる所以である.しかしながら,現在までに唱えられてき た接着の理論(説)を**表1**にまとめた.

表1 接着の理論

| 三谷 | 好 へ 操 推 | | |
|---------|----------------------|--|--|
| 記 | 結合機構 | | |
| 機械的結合説 | 投錨効果 (アンカー効果) | | |
| 分子拡散説 | 相互拡散 | | |
| 静電気・電子説 | 静電気力,電位差 | | |
| 酸 - 塩基説 | 酸-塩基結合 | | |
| 化学的吸着説 | 1次結合:イオン結合,共有結合,金属結合 | | |
| | 2次結合:水素結合 | | |
| | ファンデルワールス結合(配向力,誘起力, | | |
| | 分散力) | | |

機械的結合説,いわゆるアンカー効果による接着は繊維, 木材及び金属粗面への接着などに用いられる理論である. 分子拡散説はゴム同士の接着,高分子材料の溶剤接着,相



石井敏也*

| 分析手法 | 情報 | 検出深さ | 検出感度 | 空間分解能 | プローブ | 検出信号 |
|----------------|----------------|--------------|--------------------|-----------|------|--------|
| X 線光電子分光法 | 元素(分布), 化学結合状態 | 数 nm | 約 0.1% | $10\mu m$ | X 線 | 光電子 |
| XPS (ESCA) | | | | | | |
| 2次イオン質量分析法 | 元素,分布 | 数 nm | $\rm ppm \sim ppb$ | 200nm | イオン | 2次イオン |
| SIMS, TOF-SIMS | (構造) | | | | | |
| オージェ電子分光法 | 元素,分布 | 数 nm | 約 0.1% | 30nm | 電子線 | オージェ電子 |
| AES | | | | | | |
| 電子線微小部分析法 | 元素,分布 | 1 <i>µ</i> m | 約 0.1% | $1 \mu m$ | 電子線 | 特性X線 |
| EPMA | | | | | | |
| 電界放射型走查電子顕微鏡 | 表面形態 | 数 nm | - | 0.7nm | 電子線 | 2 次電子 |
| FE-SEM | | | | | | |
| 原子間力顕微鏡 | 表面形態,表面粗さ | | 0.01nm | 0.1nm | 短針 | 原子間力 |
| AFM | | | | | | |

表2 代表的な表面分析手法

溶性プラスチックの溶融接着などに用いられる説である. 静電気・電子説は接触界面における電位差(電気的ポテン シャルエネルギーの差)が接着の主要因と考える説で,金 属と半導体や絶縁体の接着などの説明に用いられる.酸-塩基説は接着系の酸-塩基相互作用が界面の結合に大きな 役割を果たす説で,金属酸化物と高分子材料の接着などの 説明に用いられる.化学的吸着説は緊密に接触した界面に おける原子間および分子間の引力相互作用が原因で接着す るという説で,相互作用には1次結合と2次結合がある. カップリング剤,プライマー,架橋接着,ナイロン製タイ ヤコードとフェノール樹脂など接着一般に用いられる説で ある²⁾.

3. 表面分析の種類と接着への応用

現在,接着系に関わる接着力は分子間力が重要である. この分子間力が作用する接着系の被着体表面の深さは最表 面から数ナノメーター以内である.このため,接着性を評 価・解析するためには、このような最表面から深さ数ナノ メーターの領域を分析する手法を用いなければならない. 表2に代表的な表面分析方法を示す.この中で多くの解 析に用いられる分析手法はX線光電子分光法(XPS)で 導電性を持つ金属から絶縁物である高分子材料まで測定が 可能なため有用な手段といえる. XPSの測定原理は、高 真空中で固体試料表面に特定エネルギーの軟 X 線(AlKa 線また MgKa線)を照射すると光電効果により試料から 光電子が放出される.この光電子をアナライザーに導き, 運動エネルギーで分けてスペクトルで検出する. 真空中 に放出される光電子の脱出深さが数ナノメートルである ため、表面層のごく浅い領域が分析できる.飛行時間型2 次イオン質量分析法(TOF-SIMS)も同様な特徴をもつ. TOF-SISM の測定原理は、高真空中で1次イオンビーム

(Ga,Cs,Auなど)を固体試料表面にぶつけると、スパッタ リング現象によって表面層の構成成分が弾き飛ばされる. このとき発生する正または負の電荷を帯びた2次イオンを 電場によって一定方向に飛ばして、一定距離離れた位置で 検出する.

2次イオンは試料表面の組成に応じて様々な質量をもっ て発生し、この2次イオンが検出されるまでの飛行時間 を測定すれば、質量を計算することができる. TOF-SIMS は1次イオンの照射量が少ないため、試料表面から真空中 に飛び出すことのできる2次イオンの深さは数ナノメール である.

一方,接着性に関わる要因は化学的なことではなく,被 着体表面の微細な凹凸や接着界面にかかる力学的な応力 が影響する場合もある.表面の微細構造を定量化するため の分析装置として原子間力顕微鏡(AFM)があげられる. AFM は大気圧下で原子レベルの分解能を有する顕微鏡で あり,試料表面の微細構造のみならず表面粗さなど画像懐 石が容易にできる特徴をもつ.AFM の動作原理は,感知 レバーと呼ばれる微小な探針と試料表面に働く原子間力 (斥力または引力)を検出し,その力が一定になるように 試料表面を走査して,表面の凹凸を描き出すものである. 表3に接着性に影響する因子とその評価するために有用で ある分析手法についてまとめた³⁾.

表3 接着に影響する因子とその分析方法

| 接着に影響する因子 | 分析手法 |
|----------------|----------|
| 表面組成, 化学構造・官能基 | XPS |
| | TOF-SIMS |
| 表面微細形状 | FE-SEM |
| | AFM |
| 表面の力学的・熱的性質 | ナノインデンター |
| | μΤΑ |
| | 剛体振り子 |
| 濡れ性 | 接触角 |
| 表面自由エネルギー | |

なお,表2に示したその他の分析手法の詳細な原理はそ れぞれの専門書を参照されたい.

4. 接着性を解析した応用例

熱水処理アルミニウム箔と低密度ポリエチレンの接着性 について、XPS、TOF-SIMS、FE-SEM、AFMを用いて 解析した例を紹介する.

アルミニウムは高温水や加圧水蒸気で処理すると、ベーマイトを含む透明で緻密な水和酸化皮膜を生成する。ベーマイトを生成する反応式は次式で表される⁴⁾.

2Al+4H₂O→2AlOOH (ベーマイト) +3H₂↑

特に電気伝導度 10µS/cm 以下の純度の高い水で処理す ると結晶性の高い針状の無色透明なベーマイト皮膜を生成 する⁵⁾. また,アンモニアやトリエタノールアミンが皮膜 成長速度を大きくするための反応促進剤として使用され る.

本実験に使用した試料は、東洋アルミニウム(株)製の JIS 規格 1N30(アルミニウム純度 99.4%)の厚さ7µmの アルミニウム箔である.また処理時間は75秒とした.こ のアルミニウム箔に押出しラミネーターを用いて、溶融 押出し温度 320℃で低密度ポリエチレン(LDPE)を厚さ 30µmでアルミニウム箔表面に貼り合わせた.ベーマイト 処理アルミニウム箔表面と LDPE は強く接着する.これ らのはく離強度を測定するために、以下の構成でラミネー トフィルムを作製した.

試料構成:PET (12) //Al (ベーマイト) /LDPE (30) /LDPE (40) //PET (25)

括弧内 の数字はそれぞれのフィルムの厚みで,単位は µm である.また,//部はウレタン系接着剤を使用して ドライラミネーションにより貼り合わせた部分である.ア ルミニウム箔と LDPE (30)間のはく離強度は,アルミニ ウム箔未処理試料では約 100N/m,ベーマイト処理試料で は約 800N/m で,ベーマイト処理面は未処理面と比べて 8 倍の強度まではく離強度が向上する⁶⁾.

4.1 化学的効果の解析

ベーマイト処理面とLDPEの接着要因として,まず化 学的な効果が考えられる.そこでLDPE表面の化学状態 を調べるため,X線光電子分光法(XPS)を用いて解析を 行った.溶融押出しされたLDPE表面は熱酸化によって 接着性に有利に働く極性官能基が導入されているはずであ る.XPSで測定されたClsピークの波形分離結果を図1

に示す.

LDPE 表面には C-OH 結合と C=O 結合が生成している ことがわかる.次にベーマイト処理面の化学的状態を調べ るため,XPS と飛行時間型 2 次イオン質量分析法(TOF-SIMS)を用いて表面分析を行った.未処理面とベーマイト 処理面の O1s ピークの波形分離結果を図 2 に示す.未処 理面に比べ,ベーマイト処理面は OH 基に帰属されるピ ークが高くなっていることがわかる.また,表4に TOF-SIMS で測定された negative イオンの質量数 16 の酸素(O) のピークと水酸基の OH(17)のピーク強度とそれらのピ ーク強度比を示す.比較のためサファイア基板のデータも 載せた.

XPS 分析の結果と同様に,未処理面よりベーマイト処 理面の方が OH (17) /O (16) の値が大きく,両者の分析 結果から LDPE 表面とベーマイト処理表面に接着性を向 上させるのに有利な OH 基や C=O 基が存在していること







図 2 アルミニウム箔表面の O1s ピーク波形分離スペクトル (a) 未処理面, (b) ベーマイト処理面

第42巻第5号(2005)

が解析された7). LDPE とベーマイト処理表面の表面分 析の結果から,接着に対する極性官能基の生成が接着性向 上要因の1つとしてあげられるのは間違いないことがわか った.接着要因を解析する分析手法として XPS と TOF-SIMS は有効な手段であることがわかる.

一方,金属の表面処理は一般的に化学的な変化だけでは なく,表面形状が変化していることが考えられる.このた め,次に物理(機械)的な効果について解析を行った.

| | | • | , |
|-------|--------|--------|--------------|
| 処理時間 | O(16) | OH(17) | OH(17)/O(16) |
| 0 | 428521 | 345652 | 0.81 |
| 75 | 591604 | 602202 | 1.02 |
| サファイア | 286965 | 236313 | 0.82 |

表 4 TOF-SIMS で求めた OH(17)/O(16)

4.2 物理(機械)的効果の解析

最近の走査電子顕微鏡(SEM)では、低加速電圧で、 かつ試料にバイアス電圧をかけて導電処理を行うことなく 半導体や絶縁物の観察が行えるようになってきた.このため、微細な表面形状が導電処理によりスパッタされた金属 粒子がまるで雪が降り積もったように表面形状を覆い隠す ことがなくなり、今まで知られていた材料の表面形状が異 なっていることがわかってきた.この手法を用いてアルミ ニウム箔未処理面とベーマイト処理面の表面形状を電界放 射型走査電子顕微鏡(FE-SEM)を用い、導電処理を行わ ずに表面観察を行った.図3に未処理面とベーマイト処理 面の SEM 像を示す.



図 3 アルミニウム箔表面の SEM 像 (A) 未処理面, (B) ベーマ イト処理面

未処理面(A)は滑らかな表面で,圧延による傷と考え られる筋が観察されている.処理時間75秒(B)は複雑 な花弁状の構造に成長していることがわかった.このベー マイト花弁状構造の幅は約5nmであった.このように導 電処理を施さなければ観察できなかった金属の水和酸化物 が導電処理に観察できるようになった.比較のため白金を スパッタした場合のSEM像を図4に示す.ベーマイトの ような微細構造に導電処理をした場合,スパッタされた金 属の厚みが仮に10nmとすると,ベーマイトの花弁状構造 の幅は約30nm程度の幅になってしまうため,全く別の形 状が観察されてしまう.





図 4 白金スパッタされたアルミニウム箔表面の SEM 像 (A)未処理面, (B) ベーマイト処理面

次にベーマイト処理面形状の定量化を原子間力顕微鏡 (AFM) で行った.図5にAFM 像を表5に二乗平均粗さ (RMS) と測定エリアに対する表面積比を示す.

表5 AFM で求めた表面粗さと表面積比

| 処理時間(秒) | RMS(nm) | 表面積比 |
|---------|---------|------|
| 0 | 2.9 | 1.00 |
| 75 | 21.1 | 1.76 |

未処理面とベーマイト処理面を比較すると RMS は約7倍,表面積比は約1.8 に増加していた⁶⁾. SEM 像及び AFM データよりベーマイト処理面と LDPE の接着は化学 的効果だけではなく,機械的な要因として LDPE がベー マイト構造に浸透していれば,接触面積の増加やアンカー

日本印刷学会誌



図 5 アルミニウム箔表面の AFM 像 (A) 未処理面, (B) ベーマ イト処理面

効果によっても接着していることが十分に考えられる結果 となった. 以上の表面分析の結果およびはく離強度から 接着向上因子を推定するが、ベーマイトと LDPE の接着 界面がどのように侵入しているか実際には不明のままであ る. 接着界面の状態の分析は非常に困難である. 通常, は く離試験を行った場合、基材ベーマイトの破壊や LDPE の塑性変形により、両者の接着界面の形態を保ったままの 状態ではく離することはない. 筆者はベーマイトと LDPE の化学的結合因子は水素結合が主であると考え、水素結合 ならば接着界面に水を侵入させれば化学的な結合を弱めら れると考え、LDPE のベーマイト構造への侵入状態を調べ るため、試験片を水に3日間浸漬し、かつ水中で試験片を はく離することを試みた.図6に水浸漬後のベーマイト 処理面側はく離面と LDPE 側はく離面の SEM 像を示す. 図6に示したように LDPE 側はく離面はほとんど塑性変 形することなく、はく離することに成功し、LDPE はベー マイト構造の空隙に侵入していることがわかった. さらに LDPE の侵入形態を定量化するため水浸漬後はく離した LDPE 側はく離面の表面形状をベーマイト処理面と同様に AFM を用いて定量化を行った. 表6に AFM データを示 す.表5のベーマイト処理面のデータと比較するとRMS と表面積比はほぼ同一の値を示した.LDPE はベーマイト 処理面に侵入していることがわかった.したがって,ベ ーマイトと LDPE の接着は化学的には両者が水素結合し, 物理的にはアンカー効果によって接着しているという考え に至った⁶⁾.このように機器分析法に頼ることなく,はく 離方法を工夫することにより接着界面状態を観察や定量化 し,接着の要因を解析することも可能であると考えられる.

表 6 水浸漬後 LDPE 側はく離面の表面粗さと表面積比

| 処理時間(秒) | RMS(nm) | 表面積比 |
|---------|---------|------|
| 0 | 5.7 | 1.05 |
| 75 | 23.9 | 1.41 |

5. おわりに

接着に関わる表面分析技術について,接着の理論,表面 分析方法の種類,接着に及ぼす因子とその分析方法につ いて解説を行い,表面分析を用いて解析した例について述 べた.接着は物質表面の化学状態や表面形状が重要な役割 を果たしているが,力学的性質なども複雑に影響してい る現象である.近年,表面・界面の分析技術の進歩によ って約20年前までは考えられなかった表面・界面の情報 を得ることが可能となってきた.たとえば,赤外可視和周 波発生(SFG)分光法による金属酸化物と高分子材料界面

283

の相互作用の解析⁸⁾, エネルギーフィルター透過電子顕微 鏡(EFTEM)によるポリブチレンテレフタレート(PBT) とエポキシ系接着剤の接着界面の解析と接着阻害要因の解 析などが報告されている⁹⁾.しかし,接着界面の状態を解 析することは非常に困難であることに変わりはない.今後, 接着という現象のメカニズムを解明するために接着界面を ナノメートルのオーダーで分析する技術や分析試料の前処 理技術が開発されることを期待する.

参考文献

1) 竹本喜一,三刀基郷, "接着の科学", 講談社, (1997).

- 2) 日本表面科学会編, "表面科学の基礎と応用", フジ・テク ノシステム (1991).
- 3) 中川善嗣, The TRC News, **79**, 20 (2002).
- 4)小川俊夫,田中貴之,平位拓也,大沢 敏,志保沢正幸, 日本接着学会,33 (2),47 (1997).
- 5) 山田啓之, 岡本常義, 軽金属, 21 (6), 398 (1971).
- 6) 石井敏也,本郷忠志,森田まち子,小川俊夫,高分子論文集,
 60 (7),335 (2003).
- 石井敏也,小川俊夫,斉藤雅美,高分子論文集,58 (7), 353 (2001).
- 8) 宮前孝行, 日本接着学会誌, 41 (5), 177 (2005).
- 9) 堀内 伸, 日本接着学会誌, 41 (5), 196 (2005).